



中国科学院大连化物所

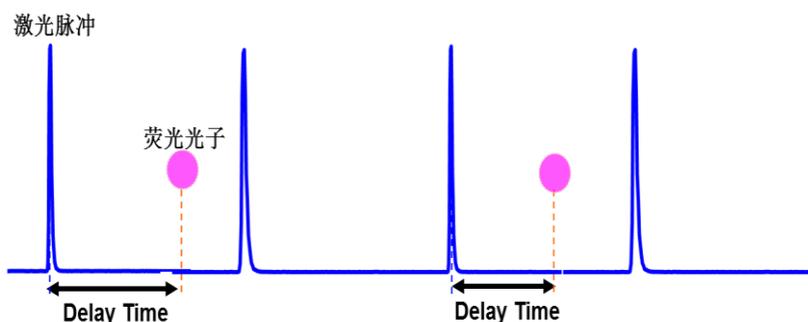
荧光寿命光谱仪 TPL-200

荧光光谱仪又称荧光分光光度计，是一种定性、定量分析的仪器。通过荧光光谱仪的检测，可以获得物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、荧光偏振与去偏振特性，以及荧光的淬灭方面的信息。



性能指标

- TCSPC 寿命系统;
- 时间计时精度 $< 50\text{ps}$; bin 精度 1ps
- 激发光源: 超连续白光脉冲光源, 波长 400-800nm 全范围可调 (也可根据需求配备单波长皮秒光源)
- 检测器: 高灵敏度单光子检测器, 检测范围: 400-1000 nm,
- 整体仪器响应时间(IRF): $< 200\text{ps}$
- 寿命检测范围 $\sim 50\text{ps}$ 到 $10\mu\text{s}$ (可拓展至百微秒)
- USB 即插即用
- 适用溶液和固态薄膜样品
- 基于用户需求的自定义设备操作和数据处理程序



特点

基于用户需求的自定义设备操作程序和数据处理程序:

- 可即时观测实验过程中样品荧光强度随时间的变化;
- 可对衰减数据做单指数、多指数、幂指数等寿命拟合;
- 可获取样品荧光寿命随宏观时间变化动力学曲线(Lifetime trajectory);
- 本软件可根据用户需要添加附加功能。

北京佳诺贝科技有限责任公司, 北京市海淀区林大北路北林印刷厂 3-201 室

电话/传真: 86-10-62395650 邮箱: sales@jnbt-plasma.com